



Харківський національний університет радіоелектроніки

**Наукова бібліотека ХНУРЕ
Видатні науковці**

Гордієнко Юрій Омелянович

Біобібліографічний покажчик

**Харків
2010**

ББК Ч75
Г 68
УДК 016 : 621.385

Упорядник Аврамова І. П.
Відповідальний редактор Чижевська Л. М.

Гордієнко Юрій Омелянович : [До 70-річчя від дня народження]
: [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. І. П. Аврамова ;
відповід. ред. Л. М. Чижевська. – Х. : ХНУРЕ, 2010. – 48 с. –
(Видатні науковці).

ББК Ч75
УДК 016 : 621.385

Наукова бібліотека ХНУРЕ
2010

Зміст

Передмова.....	4
Шлях наукових досягнень.....	5
Основні дати життя та діяльності Ю. О. Гордієнка.....	7
Бібліографія праць Ю. О. Гордієнка.....	8
Наукова школа Ю. О. Гордієнка.....	44
Іменний покажчик співавторів праць Ю. О. Гордієнка.....	41

Передмова

Видання біобібліографічного покажчика присвячено 70-річчю від дня народження завідувача кафедрою мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, Заслуженого діяча науки і техніки України Ю. О. Гордієнка.

Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановою науковою діяльністю Ю. О. Гордієнка, відобразити його праці. До складу покажчика увійшли бібліографічні описи опублікованих і неопублікованих праць, навчальних посібників, монографій, патентів, авторських свідоцтв, дисертацій і авторефератів дисертацій, статей із періодичних видань, депонованих рукописів, матеріалів наукових конференцій і публікацій англійською мовою.

Література розташована в хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку наукової творчості вченого, у межах року – в алфавіті назв документів. Авторські свідоцтва, патенти та публікації англійською мовою представлені наприкінці списку літератури за кожний рік. Видання доповнене іменним покажчиком.

Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам спеціальностей мікро- і наноелектроніки, електронних приладів, пристроїв та систем, а також фахівцям у галузі освіти.

Шлях наукових досягнень

Після закінчення радіофізичного факультету Харківського державного університету Юрій Омелянович Гордієнко в 1963 році був прийнятий на посаду асистента кафедри електронних приладів Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАВТ – нині ХНУРЕ). Закінчивши аспірантуру ХІГМАВТа, працював старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедрами електронних приладів; мікроелектроніки; мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв.

Юрій Омелянович – активний поборник усього нового, що існує у світовій науці в області електроніки. Наприкінці 60-х років він став ініціатором становлення на кафедрі електронних приладів і в інституті напрямку напівпровідникової електроніки. З початку 80-х років на кафедрі мікроелектроніки, яку очолив Юрій Омелянович, відбулося активне впровадження в навчальний процес напівпровідникової мікроелектроніки. Зараз на кафедрі мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв, якою завідує Ю. О. Гордієнко, усе впевненіше стверджується наноелектронний напрямок. Відкрито нову спеціальність «Мікро- і наноелектроніка», успішно функціонує лабораторія наноелектроніки й нанотехнологій.

Доктор фізико-математичних наук Ю. О. Гордієнко широко відомий в Україні та за її межами, як вчений в області мікрохвильових методів діагностики функціональних матеріалів мікроелектроніки. Він є членом редколегії 4 науково-технічних журналів, автором понад 250 наукових праць, у тому числі 8 підручників і навчальних посібників, 30 патентів і винаходів; керівником 12 науково-дослідних робіт в області нанофізики й нанотехнологій, з яких 3 проводяться за Постановами Кабінету Міністрів України. В 2010 році вийшла друком монографія «Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем».

Юрієм Омеляновичем створена загальна теорія надвисокочастотної діагностики матеріалів і середовищ, обґрунтовано і розвинуто новий модуляційний метод вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів. В результаті досягнень теоретичного аналізу й експериментальних досліджень запропоновані, розроблені та впроваджені в практику вхідного та міжопераційного контролю в технології мікроелектроніки нові прилади неруйнівного безелектродного контролю.

Ним також розроблена загальна теорія мікроапертурних резонаторних зондів для скануючої мікрохвильової мікроскопії напівпровідників. Створюваний на кафедрі МЕЕПП ХНУРЕ перший в Україні скануючий мікрохвильовий мікроскоп дозволить вирішувати найважливіші завдання сучасних нанотехнологій.

З урахуванням необхідності вирішення проблем економіки України Ю.О. Гордієнком розроблена загальна теорія надвисокочастотної вологометрії, що відкриває перспективи створення новітніх приладів експресного контролю вмісту вологи в різноманітних технологічних матеріалах і сільгосппродукції.

В 2010 році розробки Ю.О. Гордієнка висунуті на здобуття Державної премії України в області науки і техніки.

Заслужений діяч науки й техніки України Ю. О. Гордієнко є членом експертної ради ВАК України, представником МОН України в робочій групі Євразійської співдружності по програмі електронізації, членом експертних комісій МОН України в області приладобудування й матеріалознавства, заступником голови спеціалізованої вченої ради по присвоєнню вченого ступеня доктора наук. В науковій школі, що створив і очолює Ю. О. Гордієнко, під його безпосереднім керівництвом підготовлено й успішно захищено 16 кандидатських і 4 докторські дисертації. В 1999 р. він нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, а в 2005 році Почесною грамотою Верховної Ради України. За впровадження наукових результатів в освіту та промисловість неодноразово заохочувався керівництвом МОН України, адміністрацією області, міста й університету.

Видатний вчений Ю. О. Гордієнко є також цікавою людиною й у звичайному житті. Грибник, захоплюється рибалкою. Походи на байдарках по ріках України, Центральної смуги Росії, Середнього й Північного Уралу, Кольського півострова – невід’ємна частина біографії Юрія Омеляновича.

Основні дати життя та діяльності Ю. О. Гордієнка

Гордієнко Ю. О. народився 31 серпня 1940 року м. Лебедин Сумської області.

1957 р. – став студентом Харківського державного університету ім. О. М. Горького.

1962 р. – закінчив університет по спеціальності радіофізика і електроніка.

1963 р. – почав працювати асистентом кафедри електронних приладів Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики обчислювальної техніки (нині ХНУРЕ).

1969 р. – захистив кандидатську дисертацію.

1983–1996 рр. – очолює кафедру мікроелектроніки.

1985 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю радіофізика.

З 1996 р. – очолює кафедру мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв ХНУРЕ.

1999 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

2005 р. – нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом».

2008 р. – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ

ЮРІЯ ОМЕЛЯНОВИЧА ГОРДІЄНКО

1967

1. Об одной возможности автоматической записи кинетики роста сферолитов в аморфных слоях Se [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин, Н. А. Коваленко, А. Л. Горелик // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1967. – Вып. 6. – С. 89–91.

1968

2. Применение СВЧ-техники для исследования высокоомных слоев аморфного селена [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1968. – Вып. 10. – С. 132–138.
3. Применение техники СВЧ для исследования некоторых физико-электрических свойств аморфных слоев селена [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Ю. Е. Гордиенко ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. - Х. : ХИРЭ, 1968. – 299 с. : ил.

1969

4. Влияние технологии напыления на частичную кристаллизацию слоев аморфного селена. Ч. I [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1969. – Вып. 11. – С. 127–134.
5. Влияние технологии напыления на частичную кристаллизацию слоев аморфного селена. Ч. II [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1969. – Вып. 11. – С. 135–140.
6. Прецизионное измерение малых $\text{tg } \delta$ на СВЧ [Текст] // Ю. Е. Гордиенко, Н. К. Соболев // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1969. – Вып. 10. – С. 62–66.
7. Применение техники СВЧ для исследования физико-электрических свойств аморфных слоев селена [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю. Е. Гордиенко ; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х., 1969. – 18 с.

1971

8. К исследованию кристаллизации стеклообразных полупроводников радиофизическим методом [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 17. – С. 44–47.
9. Многоэлементный приемник излучения для систем визуализации ИК изображения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло, В. И. Буллах // Электронная техника. Сер. 4. – 1971. – Вып. 1. – С. 15–22.

1972

10. Измерение диэлектрической проницаемости полупроводниковых пленок на изолирующих подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 21. – С. 201–206.
11. Измерение толщины эпитаксиальных полупроводниковых пленок на низкоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло // Электронная техника. Сер. 8. – 1972. – Вып. 10. – С. 22–27.
12. К анализу работы электролюминесцентного преобразователя изображения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло, В. И. Буллах // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 23. – С. 28–33.

1973

13. Основные соотношения для электролюминесцентного преобразователя изображения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Приборы и системы автоматики : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1973. – Вып. 28. – С. 124–129.
14. Применение техники СВЧ для неразрушающего контроля селеновых электрофотографических пластин и мишеней рентген видиконов [Текст] / Ю.Е. Гордиенко, И. Т. Чужиков, Е. С. Хорошайло // Электронная техника. Сер. 8. – 1973. – Вып. 5. – С. 70–76.
15. Разработка методики и макета установки для измерения толщины и удельного сопротивления эпитаксиальных слоев [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко

; исполн. : В. В. Старостенко, Ю. А. Дудкин. – № ГР 72014655 ; Инв. № Б 298052. – Х., 1973. – 99 с.

1974

16. Измерение проводимости эпитаксиальных полупроводниковых пленок на сильно легированных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1974. – Вып. 31. – С. 81–87.
17. Измерение толщины тонких эпитаксиальных пленок с помощью техники СВЧ [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, С. С. Бурдукова, Ю. А. Дудкин // Материалы II Всесоюзного симпозиума по эффекту Ганна. – Новосибирск, 1974. – С. 190–191.
18. Измерительные преобразователи для неразрушающего контроля электропроводности пленок в эпитаксиальных структурах np^+ типа [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. В. Старостенко // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 9. – С. 112–118.
19. Кинетика кристаллизации аморфных конденсатов селена [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Кристаллография. – 1974. – № 2. – С. 352–355.
20. Некоторые особенности техники исследования полупроводников на СВЧ [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1974. – Вып. 31. – С. 87–90.
21. Неразрушающий контроль электропроводности и толщины эпитаксиальных пленок на высокоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 7. – С. 91–98.
22. Прибор для измерения толщины полупроводниковых эпитаксиальных пленок на низкоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, Ю. А. Дудкин, В. Е. Шевченко // Приборы и техника эксперимента. – 1974. – № 4. – С. 196–199.
23. Расширение диапазона СВЧ измерений удельного сопротивления полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. В. Старостенко // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 11. – С. 35–42.
24. Теоретическая возможность неразрушающего контроля параметров эпитаксиальных пленок в многослойных структурах на сильно легированных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В.

Старостенко, С. С. Бурдукова, Л. И. Свидерская // Электронная техника. Сер. 8. – 1974. – Вып. 9. – С. 56–64.

25. А. с. 458296 СССР, МКИ Н Ој 31/50. Преобразователь изображения для инфракрасного излучения [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Чужиков И. Т. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 1841484/26-9 ; заявл. 30.10.72 ; опубл. 26.09.74. – 4 с. : ил.

1975

26. Анализ показателей точности неразрушающего контроля толщины эпитаксиальных пленок СВЧ средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко // Электронная техника. Сер. 8. – 1975. – Вып. 10. – С. 63–67.
27. Влияние предварительной термообработки в электрическом поле на кристаллизацию аморфных конденсатов селена / Ю. Е. Гордиенко, Л. П. Мельникова, В. Л. Костенко, // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1975. – Вып. 33. – С. 161–165.
28. Неразрушающий контроль параметров однотипных структур электромагнитными СВЧ средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Ю. А. Дудкин, В. В. Старостенко // Электромагнитные методы контроля качества материалов и изделий : сб. науч. тр. – Рига, 1975. – С. 236–242.
29. Повышение точности контроля электропроводности эпитаксиальных структур СВЧ-средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, Ю. И. Гуд // Проблемы теоретической и экспериментальной метрологии : сб. науч. тр. – Л., 1975.
30. Применение СВЧ-средств для контроля неоднородности параметров полупроводниковых пластин [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, В. П. Крупа // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1974. – Вып. 33. – С. 151–157.
31. Разработка методики и макета установки для измерения толщины и удельного сопротивления эпитаксиальных слоев [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко; исполн. : В. В. Старостенко, Ю. А. Дудкин. – № ГР 72014655 ; Инв. № Б 298052. – Х., 1973. – 99 с.
32. Фотокристаллизация аморфных конденсатов селена [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко, Л. П. Мельникова // Кристаллография. – 1975. – № 5. – С. 1000–1003.

33. А. с. 456197 СССР, МКИ G 01n 23/24. Волноводная ячейка для измерения электромагнитных характеристик веществ [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Старостенко В. В. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 1776891/25-28 ; заявл. 24.04.72 ; опубл. 05.01.75, Бюл. № 1. – 2 с. : ил.

1976

34. Влияние температуры пара на кинетику кристаллизации селеновых мишеней видиконов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Электронная техника. Сер. 6. – 1976. – Вып. 2. – С. 7–11.
35. Контроль глубины вскрытия эпитаксиальных структур на поликристаллических подложках СВЧ-средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – X. : Вища шк., 1976. – Вып. 38. – С. 161–165.
36. Определение характеристик фоторезисторного приемника излучения с СВЧ-смещением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. И. Свидерская // Радиотехника : науч.-техн. сб. – X. : Вища шк., 1976. – Вып. 37. – С. 88–93.
37. Оптимизация СВЧ-измерительных преобразователей для контроля электропроводности эпитаксиальных пленок в однотипных структурах [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Радиотехника : науч.-техн. сб. – X. : Вища шк., 1976. – Вып. 37. – С. 130–136.
38. Характеристики СВЧ-измерительного преобразователя при контроле эпитаксиальных структур с переходными слоями [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. И. Свидерская // Техническая электроника и электродинамика : науч.-техн. сб. – Саратов, 1976. – Вып.1. – С. 49–56.
39. А. с. 488269 СССР, МКИ В 01J 29/10. Способ изготовления мишени видикона [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Костенко В. Л. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 1979283/26-25 ; заявл. 25.12.73 ; опубл. 15.10.75, Бюл. № 38. – 2 с.
40. А. с. 519786 СССР, МКИ Н 01J 31/50. Преобразователь изображения [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Чужиков И. Т., Булах В. И., Цырлин Л. Э. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники . – № 2031468/25 ; заявл. 07.06.74 ; опубл. 30.06.76, Бюл. № 24. – 4 с. : ил.

41. Анализ характеристик преобразования СВЧ-преобразователей при измерении параметров неоднородных полупроводниковых слоев [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. И. Свидерская // Физические основы построения первичных измерительных преобразователей : сб. науч. тр. – Винница, 1977. – С. 42–46.
42. Исследование возможности применения СВЧ методов для неразрушающего контроля параметров конденсированных полупроводниковых и диэлектрических покрытий на металлических подложках [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко, А. П. Ключко. – № ГР 75037554 ; Инв. № Б 650193. – Х., 1977. – 130 с.
43. К расчету характеристик резонаторного преобразователя для измерения параметров неоднородных полупроводниковых слоев [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. И. Свидерская // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1977. – Вып. 43. – С. 104–108.
44. Модуляционный метод измерения удельного сопротивления эпитаксиальных пленок однотипных структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // XXXII Всесоюз. сессия НТО РЭС им. А. С. Попова : тез. докл. – М., 1977. – С. 43.
45. Модуляционный метод СВЧ неразрушающего контроля материалов полупроводниковой электроники [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Ю. А. Дудкин, Б. Г. Бородин // Неразрушающие методы и средства контроля : сб. науч. тр. – Кишинев, 1977. – С. 463–466.
46. Об одном методе СВЧ-диагностики полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1977. – Вып. 40. – С. 104–108.
47. Определение времени релаксации носителей СВЧ-средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин, Б. Г. Бородин // XXXII Всесоюз. Сессия НТО РЭС им. А. С. Попова : тез. докл. – М., 1977. – С. 42–43.
48. СВЧ-преобразователи для измерения удельного сопротивления полупроводниковых эпитаксиальных пленок [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Л. П. Мельникова // Физические основы

построения первичных измерительных преобразователей : сб. науч. тр.– Винница, 1977. – С. 52.

49. Техника безэлектродного измерения электрофизических параметров полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Ю. В. Попов // Заводская лаборатория. – 1977. – № 12. – С. 1494–1497.
50. Усовершенствование радиофизического метода исследования кристаллизации селеновых слоев [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Л. Костенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1977. – Вып. 41. – С. 111–116.
51. Установка для исследования фотопроводимости полупроводников при сверхвысокочастотном смещении [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин, Б. Г. Бородин // Приборы и техника эксперимента. – 1977. – № 1. – С. 239–241.
52. Электропроводность тонких полупроводниковых пленок в СВЧ-полях [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1977. – Вып. 41. – С. 116–119.

1978

53. Контроль распределения удельного сопротивления полупроводников СВЧ-средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. А. Алексеев // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1978. – Вып. 45. – С. 110–113.
54. А. с. 594546 СССР, МКИ Н О1 J 29/45. Многоэлементная мишень видикона [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Чужиков И. Т., Степанов Р. М., Цырлин Л. Э., Фомина В. И., Хазанович И. И. – 2387932/18-25 ; заявл. 21.07.76 ; опубл. 25.02.78, Бюл. № 7. – 4 с. : ил.

1979

55. Анализ результатов испытаний и эксплуатации СВЧ прибора для измерения толщины пленок на проводящих подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. В. Старостенко, В. И. Бедратый // Контроль толщины покрытий и его метрологическое обеспечение : сб. докл. – Рига, 1979. – С. 74–75.
56. Повышение точности измерения толщины эпитаксиальных пленок СВЧ методом [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. И. Бедратый, В. В.

Старостенко // Электронная техника. Сер. 8. – 1979. – Вып. 1. – С. 73–78.

57. СВЧ резонаторный преобразователь для измерения толщины пленок на проводящих подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Контроль толщины покрытий и его метрологическое обеспечение : сб. докл. – Рига, 1979. – С. 71–73.
58. А. с. 688026 СССР. Передающая трубка с управляемым фотокатодом [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Степанов Р. М., Чужиков И. Т., Фомина В. И. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – опубл. 28.05.79. – 4 с.

1980

59. А. с. 758861 СССР, МКИ G 01 R 27/00. Способ бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов [Текст] / Гордиенко Ю.Е. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 2605021/19-09 ; заявл. 06.04.78 ; опубл. 28.04.80. – 5 с. : ил..

1981

60. Исследование электропроводности и фотопроводимости вакуумных конденсаторов халькогенидов свинца СВЧ-средствами [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. И. Бедратый ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х., 1981. – 3 с. – Деп. в ВИНТИ 17.08.81, № 2978.
61. Методы численного исследования СВЧ измерительных преобразователей для неразрушающего контроля материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Е. Ю. Черкашин, Т. И. Боровская // Оптические и радиоволновые методы и средства неразрушающего контроля материалов и изделий : сб. науч. тр. – Фергана, 1981.
62. Микроволновый измеритель толщины пленок на низкоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Ю. А. Дудкин и др. // Приборы и техника эксперимента. – 1981. – № 3. – С. 231–234.
63. Техника СВЧ неразрушающего контроля параметров полупроводниковых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин, Д. А. Федотов // Оптические и радиоволновые методы и средства неразрушающего контроля материалов и изделий : сб. науч. тр. – Фергана, 1981.

64. А. с. 886667 СССР, МКИ H01L 21/66, G01N 21/00. Способ контроля фотопроводимости узкозонных полупроводников [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Дудкин Ю. А. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 2975095/18-25 ; заявл. 13.08.80 ; опубл. 03.08.81. – 7 с. : ил.

1982

65. Определение характеристик объемных резонаторов со слоистым заполнением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 60. – С. 17–23.
66. А. с. 914938 СССР, МКИ G 01 B 15/02, G 01 R 23/04. Устройство для измерения толщины полупроводниковых и диэлектрических пленок на подложках [Текст] / Гордиенко Ю. Е. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 2936301/18-09 ; заявл. 23.05.80 ; опубл. 23.03.82, Бюл. № 11. – 2 с. : ил.
67. А. с. 928952 СССР, МКИ H01 L 21/66, G 01 N 27/00. Способ бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводников и устройство для его осуществления [Текст] / Гордиенко Ю. Е. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 3222510/18-25 ; заявл. 21.11.80 ; опубл. 14.01.82. – 10 с. : ил.
68. А. с. 991888 СССР, МКИ H 01L 31/18. Способ изготовления фотопроводящих слоев халькогенидов свинца [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Бедратый В. И. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 3242816/18-25 ; заявл. 12.12.80 ; опубл. 21.09.82. – 6 с.

1983

69. Взаимодействие электромагнитного поля СВЧ резонаторов с полупроводником через отверстие в стенке [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1983. – Вып. 67. – С. 85–90.
70. Теоретическое исследование характеристик СВЧ измерительных преобразователей для контроля слоистых полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. И. Свицерская, Е. Ю. Черкашин // Электроника СВЧ : сб. науч. тр. – Минск, 1983. – С. 56–57.
71. Установка для безэлектродного измерения времени жизни носителей заряда в полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю.

А. Дудкин, Б. Г. Бородин, Д. А. Федотов // Приборы и техника эксперимента. – 1983. – № 2. – С. 204–207.

72. Фотомодуляционный СВЧ метод контроля параметров полупроводниковых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, Ю. И. Гуд, В. Е. Старков // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1983. – Вып. 3. – С. 82–94.

1984

73. Автодинный измеритель толщины полупроводниковых пленок [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. А. Овчаренко // Заводская лаборатория. – 1984. – № 7. – С. 36–38.
74. Бесконтактное измерение подвижности носителей заряда в полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин // Приборы и техника эксперимента. – 1984. – № 2. – С. 189–191.
75. Безэлектродная СВЧ-диагностика полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин // Неразрушающие физические методы и средства контроля : сб. науч. тр. – Львов, 1984. – С. 104.
76. Развитие СВЧ резонансной толщинометрии эпитаксиальных пленок [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко // Неразрушающие физические методы и средства контроля : сб. науч. тр. – Львов, 1984.
77. СВЧ диагностика слоистых полупроводниковых материалов [Текст] : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ю. Е. Гордиенко ; МВССО УССР, Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Х., 1984. – 397 с. : ил.
78. А. с. 1123476 СССР, МКИ Н 01 L 21/66, G 01 R 27/00, G 01 N 22/00. Способ бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводников [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Бородин Б. Г. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 3366918/18-09 ; заявл. 05.12.81 ; опубл. 8.07.84. – 8 с. : ил.

1985

79. Взаимодействие тонких полупроводниковых пленок с СВЧ-резонаторным измерительным преобразователем [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. А. Овчаренко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1985. – Вып. 75. – С. 42–47.

80. Исследование в области разработки СВЧ методов и средств контроля параметров полупроводников [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : В. В. Старостенко, Л. А. Овчаренко, Ю. Е. Черкашин, Ю. Е. Хорошайло. – № ГР 01830003537 ; Инв. № 02860109071. – Х., 1985. – Ч. 1. – 90 с. ; Ч. 2. – 105 с.
81. Малогабаритный СВЧ прибор для неразрушающего контроля толщины эпитаксиальных пленок [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко, В. В. Старостенко // Радиоволновые, оптические и тепловые методы и средства НК качества промышленных изделий : сб. науч. тр. – Одесса, 1985.
82. Повышение чувствительности резонаторных ИП Е-типа для неразрушающего контроля параметров полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Радиоволновые, оптические и тепловые методы и средства НК качества пром. изделий : сб. науч. тр. – Одесса, 1985.
83. СВЧ диагностика слоистых полупроводниковых материалов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ю. Е. Гордиенко ; МВССО УССР ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х., 1985. – 33 с.
84. А. с. 1182943 СССР, МКИ Н 01 L 21/66. Способ измерения подвижности носителей заряда в полупроводниках [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Бородин Б. Г. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 3663670/24-25 ; заявл. 06.10.83 ; опубл. 1.06.85. – 5 с. : ил.

1986

85. Автоматизация контрольных операций на ранних стадиях изготовления многослойных печатных плат при серийном производстве РЭА [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. А. Арсентьев, И. Г. Главчев и др. // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1986. – № 1.
86. Расчет зависимости сопротивления интегрального резистора с МДП-структурой от управляющего напряжения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Н. Борщев, Г. В. Буеров, В. А. Долженков // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1986. – № 1.
87. А. с. 1254963 СССР, МКИ Н 01 L 21/66. Устройство для измерения времени жизни носителей заряда в полупроводниках [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Бородин Б. Г., Дудкин Ю. А., Клочко А.

П.; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 3812748/24-25 ; заявл. 15.11.84 ; опубл. 01.05.1986. – 4 с. : ил.

88. А. с. 1256532 СССР, МКИ G 01 N 27/90. Вихретоковый измеритель толщины [Текст] / Дудкин Ю. А., Федотов Д. А., Гордиенко Ю. Е., Хорошайло Ю. Е., Борщев В. Н. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 3773670/25-28 ; заявл. 17.07.84 ; опубл. 10.10.86. – 4 с. : ил.

1987

89. Исследование взаимодействия СВЧ резонаторов с неоднородно легированными по толщине полупроводниковыми слоями [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, Л. И. Свидерская // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1987. – Вып. 83. – С. 31–37.
90. Исследование и разработка технологии изготовления интегральных квантовых схем на эффекте туннелирования с повышенным быстродействием и минимальными размерами [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Е. А. Росенко, Ю. Х. Лоза. – 87–9–1, № ГР 01870087018. – Х., 1987. – 165 с.
91. СВЧ толщинометрия диэлектрических покрытий и полупроводниковых пленок [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко // Методы и средства измерения электромагнитных характеристик, материалов на ВЧ и СВЧ : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1987. – С. 11–12.
92. СВЧ диагностика эпитаксиальных структур на высокоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. А. Алексеев, А. А. Куприян // Неразрушающие физические методы и средства контроля : сб. науч. тр. – М., 1987. – Т.1. – С. 35.
93. Синтез оптимальных СВЧ резонаторных измерительных преобразователей для контроля параметров на низкоомных подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1987. – Вып. 80. – С. 105–112.

1988

94. Измерение толщины эпитаксиальных пленок полупроводниковых структур СВЧ методом [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко // Состояние и тенденции развития метрики

полупроводниковых и диэлектрических структур : сб. науч. тр. – Саратов, 1988.

95. Исследование и разработка методов и средств операционного контроля микротолщин металлических и диэлектрических пленок [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко, А. М. Тельбух, Ю. Р. Кузьминский, Б. Г. Бородин, Ю. А. Дудкин, В. П. Карнаушенко. – 87–9–2 ; № ГР 01870087019 ; Инв. 02890001515. – Х., 1988. – 143 с.
96. СВЧ неразрушающий контроль параметров полупроводниковых эпитаксиальных структур с высокоомными подложками [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин // Электронная техника. Сер. 8. – 1988. – Вып. 1. – С. 36–37.
97. Толщинометрия пленочных элементов функциональных структур ГИС [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Е. А. Морщаков // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1988. – № 2.
98. Характеристики объемных СВЧ резонаторов, апертурно нагруженных слоистой полупроводниковой средой [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Л. А. Овчаренко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1988. – Вып. 85. – С. 54–63.
99. А. с. 1398680 СССР. Способ изготовления диафрагм для электронно-лучевых приборов [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Деркач В. П., Медведев И. В., Климовицкий А. М., Слипченко Н. И., Росенко Е. А. – опубл. 2.02.1988. – 4 с.
100. А. с. 1428129 СССР. Способ бесконтактного измерения параметров неоднородно легированной полупроводниковой структуры [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Бородин Б. Г. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 4163032 ; заявл. 16.12.86 ; опубл. 1.06.1988. – 2 с.

1989

101. Использование фазового способа выделения сигналов измерительной информации при СВЧ диагностике полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, Ю. И. Гуд // Оптические, радиоволновые и тепловые методы и средства неразрушающего контроля качества изделий : сб. науч. тр. – Л., 1989. – С. 94–103.

102. Радиоволновые методы и средства контроля покрытий и функциональных пленок [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Ю. А. Дудкин, Л. А. Овчаренко // Оптические, радиоволновые и тепловые методы неразрушающего контроля : сб. науч. тр. – Могилев, 1989. – С. 171–172.
103. СВЧ толщинометрия неметаллических пленок в технологии электронного приборостроения. Ч. 1. Анализ и сравнение СВЧ резонаторных измерительных преобразователей [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. А. Арсентьев и др. // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1989. – Вып 2 . – С. 31–41.
104. СВЧ толщинометрия неметаллических пленок в технологии электронного приборостроения. Ч. 2. Анализ способов выделения сигнала измерительной информации резонаторных преобразователей [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, В. А. Арсентьев, Л. А. Овчаренко // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – Вып. 2. – 1989. – С. 46–58.
105. СВЧ фотомодуляционный метод контроля полупроводниковых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко, Л. И. Свидерская // Оптические, радиоволновые и тепловые методы неразрушающего контроля : сб. науч. тр. – Могилев, 1989. – С. 169–170.
106. А. с. 1488730 СССР, МКИ G 01 N 22/00, G 01 B 15/02. Устройство для измерения толщины полупроводниковой пленки [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Овчаренко Л. А., Гуд Ю. И. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 4250345/24-09 ; заявл. 27.05.87 ; опубл. 23.06.89, Бюл. № 23. – 2 с. : ил.
107. А. с. 1496435 СССР, МКИ G 01 B 7/06. Устройство для измерения толщины электропроводящего покрытия на электропроводящем основании [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Дудкин Ю. А., Клочко А. П., Свечкин В. П. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 4287492/25-28 ; заявл. 24.07.87 ; опубл. 11.10.89. – 3 с. : ил.

1990

108. Безэлектродные исследования физикоэлектрических свойств полупроводниковых пленок [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко // Физика и технология полупроводниковых пленок : сб. науч. тр. – Ивано-Франковск, 1990. – С. 244.

109. Измерительные преобразователи СВЧ фотомодуляционного метода контроля полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко // Контроль толщины покрытий и ее метрологическое обеспечение : сб. науч. тр. – Ижевск, 1990. – С. 39–40.
110. Компенсация влияния зазора в вихретоковых измерителях электрофизических параметров проводящих покрытий [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. А. Дудкин, А. П. Клочко // Контроль толщин покрытий и его метрологическое обеспечение : сб. науч. тр. – Ижевск, 1990.
111. Сверхвысокочастотный измеритель толщины диэлектрических и полупроводниковых пленок на проводящих подложках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко // Контроль толщины покрытий и его метрологическое обеспечение : сб. науч. тр. – Ижевск, 1990. – С. 42–44.
112. Разработка и исследование СВЧ методов и средств контроля параметров полупроводниковых материалов [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Б. Г. Бородин, В. А. Алексеев. – 88–30 ; № ГР 01890001288. – Х., 1990. – 104 с.
113. Исследование принципов построения и разработка установки контроля времени жизни носителей заряда в полупроводниковых структурах СВЧ диапазона [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьковский ин-т радиоэлектроники ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко. – 89–93 ; № ГР 01900026898. – Х., 1990. – 80 с.
114. А. с. 1591765 СССР, МКИ Н 01 L 21/66. Способ контроля параметров полупроводниковых структур [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Бородин Б. Г. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 4448173/31-25 ; заявл. 28.06.88 ; опубл. 08.05.90. – 4 с. : ил.
115. А. с. 1623441 СССР, МКИ G 01 R 31/26. Способ измерения подвижности носителей заряда в полупроводниках [Текст] / Гордиенко Ю. Е., Бородин Б. Г., Зелинский В. Л., Лобанов А. В. ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – № 4626393 ; заявл. 27.12.88 ; опубл. 22.09.90. – 4 с. : ил.

1991

116. Автодинный 8-ми фотомодуляционный измеритель относительной диэлектрической проницаемости полупроводниковых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко // Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых радиоволн : сб. науч. тр. – Х., 1991. – С. 55.
117. Возмущение H_{01n} мод цилиндрического резонатора аксиально расположенным фотопроводящим диском [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1991. – Вып. 97. – С. 82–91.
118. Метрологическое обеспечение СВЧ фотомодуляционного контроля параметров полупроводников в производстве ИС [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко // Метрологические проблемы микроэлектроники : сб. науч. тр. – М., 1991. – С. 82–83.
119. О синтезе СВЧ резонаторных измерительных преобразователей для фотомодуляционной диагностики полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1991. – Вып. 98. – С. 72–79.
120. Формирование фазовых сигналов в СВЧ диагностике полупроводниковых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Л. А. Овчаренко // Теория и практика измерений параметров электромагнитных колебаний и линий передачи : сб. науч. тр. – Х., 1991. – С. 69.
121. Пат. 2032993 Российская Федерация, МПК 6 H04N5/33. Фотоприемное устройство ИК-диапазона [Текст] / Борщев В. Н., Гордиенко Ю. Е., Ключко А. П., Черепков А. В. ; заявитель и патентообладатель Харьк. гос. техн. ун-т радиоэлектроники. – № 4921272/09 ; заявл. 25.03.91 ; опубл. 10.04.95. – 4 с.

1992

122. Безэлектродный входной и межоперационный контроль фотопроводящих материалов. Ч. 1 [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Н. Борщев, Ю. И. Гуд и др. // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1992. – С. 32–39.

123. Безэлектродный входной и межоперационный контроль фотопроводящих материалов. Ч. 2 [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Н. Борщев, Ю. И. Гуд и др. // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1992. – С. 53–60.

1993

124. О синтезе СВЧ резонаторных измерительных преобразователей для фотомодуляционной диагностики полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Криворучко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1993. – Вып. 98. – С. 72–79.
125. Синтез и оптимизация СВЧ измерительных преобразователей для контроля фотоэлектрических свойств полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Б. Г. Бородин // Методы представления и обработки случайных сигналов и полей : сб. науч. тр. – Х., 1993. – С. 61.

1994

126. Безэлектродный входной и межоперационный контроль фотопроводящих материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. Н. Борщев, В. Г. Лукомский и др. // Технология приборостроения : науч.-техн. сб. – 1994. – С. 16–22.
127. Разработка безэлектродных методов исследования новых материалов и структур для электронной техники [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХТУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Ю. И. Гуд, Б. Г. Бородин. – № ГР UA 01000336Р. – Х., 1994. – 101 с.

1995

128. Радиоволновый неразрушающий контроль материалов микроэлектроники [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Б. Г. Бородин // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. Междунар. конф., 18–21 сент. 1995 г. – Туапсе, 1995. – С. 200.
129. Радиоэлектронные приборные средства для научных исследований, технологического и экологического контроля [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХТУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Ю. И. Гуд, Б. Г. Бородин. – № ГР 0193U039118. – Х., 1995. – 133 с.

130. Методы и техника экспресс-контроля параметров металлизаций на диэлектриках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. П. Ключко // Вакуумная металлизация : сб. науч. тр. – Х., 1996. – С. 127.
131. Модуляционный метод измерения параметров материалов электронной техники [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, О. В. Крячко // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 2-й Междунар. конф., 17–19 сент. 1996 г. – Х. ; Туапсе, 1996. – Ч. 1. – С. 171.
132. Разработка комплекса СВЧ и ВЧ методов и средств неразрушающей безэлектродной диагностики материалов микроэлектроники и покрытий [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХТУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Ю. И. Гуд, Б. Г. Бородин. – № ГР 0193U039114. – Х., 1996. – 188 с.
133. Резонансные измерительные преобразователи в диагностике микрослоистых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1996. – Вып. 100. – С. 72–79.
134. СВЧ методы контроля физических параметров материалов и объектов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, А. Ю. Панченко, И. В. Сухоруков // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 2-й Междунар. конф., 17–19 сент. 1996 г. – Х. ; Туапсе, 1996. – Ч. 1. – С. 161.
135. СВЧ средства контроля влажности листовых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 2-й Междунар. конф., 17–19 сент. 1996 г. – Х. ; Туапсе, 1996. – Ч. 1. – С. 162.
136. Функціональна мікроелектроніка. Прилади із зарядовими зв'язками, циліндричні магнітні домени, давачі [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Гордієнко, В. А. Антонова, Б. Г. Бондар та ін. – К. : ІСДО, 1996. – 216 с.
137. Функціональна мікроелектроніка. Процесори [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Гордієнко, Б. Г. Бондар, В. О. Письменецький та ін. – К. : ІСДО, 1996. – 152 с.

1997

138. Модификация СВЧ-метода исследования упорядоченных структурообразований в аморфных полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Р. С. Фар // Радиоэлектроника и информатика. – 1997. – № 1. – С. 43–45.
139. Развитие техники безэлектродного СВЧ контроля удельного сопротивления полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, И. В. Сухоруков // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 1997. – Вып. 104. – С. 56–61.
140. СВЧ резонаторные методы безэлектродной диагностики материалов и объектов / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, А. И. Кочержин // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 3-й Междунар. конф. 16–18 сент. 1997 г. – Х. ; Туапсе, 1997. – С. 339.
141. СВЧ фотомодуляционный метод исследования рекомбинационных процессов в полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Смуглий // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : Вища шк., 1997. – Вып. 103. – С. 73–84.
142. Теоретическое описание СВЧ резонаторных измерительных преобразователей для неразрушающего контроля материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Неразрушающий контроль и техническая диагностика : сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1997.

1998

143. Информационные сигналы при СВЧ диагностике аморфных полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Р. С. Фар // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 4-й Междунар. конф., 28–30 сент. 1998 г. – Х., 1998. – С. 436–437.
144. Основы микрорелектронных устройств [Текст] : учеб. пособие / Б. Г. Бондарь, А. В. Бородин, Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко ; под ред. Ю. Е. Гордиенко ; М-во образования Украины, ИСМО, ХТУРЭ. – К. : ИСМО, 1998. – 216 с.
145. Приближение заданного поля в задачах определения характеристик резонаторных СВЧ-датчиков апертурного типа [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко, Р. С. Фар // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 1998. – Вып. 107. – С. 93–103.

146. Радиофизические аспекты исследования структурно упорядоченных областей в аморфных полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Р. С. Фар // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 1998. – Вып. 105. – С. 24–32.
147. СВЧ резонаторный модуляционный метод контроля материалов и слоистых структур / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, Ю. И. Гуд // Современные приборы, материалы и технологии для технической диагностики и НК промышленного оборудования : сб. науч. тр. – Х., 1998. – С. 142–144.
148. Теоретическое описание СВЧ резонаторных измерительных преобразователей для неразрушающего контроля материалов / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, И. В. Сухоруков // Современные приборы, материалы и технологии для технической диагностики и НК промышленного оборудования : сб. науч. тр. – Х., 1998. – С. 145–147.
149. Фотоемкостная МДП ячейка для систем тепловидения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. И. Смуглий // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 4-й Междунар. конф., 28–30 сент. 1998 г. – Х. : ХТУРЭ, 1998. – С. 451–452.
150. Фотомодуляционная СВЧ-диагностика структурно упорядоченных областей в аморфных полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. А. Рябухин, Р. С. Фар // Радиоэлектроника и информатика. – 1998. – № 2. – С. 28–32.
151. Microwave Photomodulation Method for the Study of Recombination Processes in Semiconductors [Text] / Yu. E. Gordienko, B. G. Borodin, V. I. Smuglii // Telecommunication and Radio Engineering. – 1998. – Vol. 52, N 2. – P. 47–52.
152. Progress in semiconductor resistivity measurement using noncontact microwave test equipment [Text] / Yu. E. Gordienko, Yu. I. Gud, I. V. Sukhorukov // Telecommunication and Radio Engineering. – 1998. – Vol. 52, N 3. – P. 12–15.

1999

153. Збірник задач з електронних приладів та пристроїв : навч. посібник [Текст] / Ю. О. Гордієнко, Ю. М. Олександров, В. М. Ванцан та ін. – Х. : ХТУРЕ, 1999. – 140 с.

154. Многопараметрический модуляционный датчик с емкостной измерительной апертурой [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 1999. – Вып. 111. – С. 14–16.
155. Перспективы многопараметрических СВЧ-датчиков с модуляцией параметров в нелинейной области [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 5-й Междунар. конф., 27–30 сент. 1999 г. – Х. : ХТУРЭ, 1999. – С. 268–270.
156. Теоретические и экспериментальные основы создания радиоэлектронных средств измерений влажности материалов и сред [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХТУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Ю. И. Гуд, А. А. Рябухин. – № ГР 0197U012142. – Х., 1999. – 37 с.
157. Фотомодуляционная СВЧ диагностика полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, А. А. Рябухин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 1999. – Вып. 111. – С. 7–13.
158. Numerical algorithm for calculation of cavity microwave transducer of an aperture type [Text] / Yu. E. Gordienko, A. Yu. Panchenko, A. A. Ryabukhin // Proceedings of the 3-rd International Conference on Antenna Theory and Techniques, 8–11 September 1999. – Sevastopol, Ukraine, 1999. – P. 496–497.
159. Theoretical Analysis of a Microwave Toroidal Cavity Transducer [Text] / Yu. E. Gordienko, A. Yu. Panchenko, A. A. Ryabukhin // Telecommunications and Radio Engineering. Electromagnetic Field Theory. – New York : Begell Hous, Inc. – 1999. – Vol. 52, N 12. – С. 34–38.

2000

160. Микроволновая диагностика кинетических эффектов в полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : тез. докл. 6-й Междунар. конф., 17–19 сент. 2000 г. – Х. : ХТУРЭ, 2000. – С. 487–489.
161. Микропроцессорное обеспечение диагностических средств в полупроводниковом материаловедении [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, А. Ф. Фурдыло // Радиотехника и информатика. – 2000. – № 3. – С. 26–29.

162. Определение влагосодержания объектов и продукции лесного хозяйства радиоволновым методом [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. И. Кочержин, А. Ю. Панченко, А. А. Рябухин // Концепция развития лесной технологии в Украине : сб. науч. тр. – Х., 2000. – С. 146–149.
163. Проблемы инвариантности измерительной информации в СВЧ диагностике материалов и объектов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко, А. А. Рябухин // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : по материалам 6-й Международ. конф., 17–19 сент. 2000 г. – Х. : ХТУРЭ, 2000. – С. 457–459.
164. СВЧ резонаторные преобразователи для измерения влажности [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко, А. И. Кочержин, А. А. Рябухин // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2000) : материалы 10-й Международ. Крымской микроволновой конф., 11–15 сент. 2000 г. – Севастополь, 2000. – С. 543–544.
165. Теоретический анализ резонаторного СВЧ измерительного преобразователя тороидального типа [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко, А. А. Рябухин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 2000. – Вып. 113. – С. 174–179.
166. Тонкопленочные транзисторы на основе неупорядоченного кремния [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Д. Р. Яковлев // Радиоэлектроника и информатика. – 2000. – № 4. – С. 4–8.
167. Электродинамическая микроскопия легированных полупроводниковых структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко, А. А. Рябухин // Датчики и преобразователи информации систем измерения, контроля и управления : сб. науч. тр. – М., 2000. – С. 63–65.

2001

168. Вычисление комплексных резонансных частот СВЧ резонаторных датчиков апертурного типа [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. А. Рябухин // Радиоэлектроника и информатика. – 2001. – № 2. – С. 4–7.
169. Математические аспекты метода полевого эффекта для спектроскопии локализованных состояний в неупорядоченных полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Д. Р. Яковлев // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 2001. – Вып. 121. – С. 139–145.

170. Материалы электронной техники : учеб. пособие [Текст] / В. А. Антонова, А. В. Бородин, Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко ; МОН Украины, НМЦ ВО, ХТУРЭ. – Х. : ХТУРЭ, 2001. – 160 с.
171. Оценка влияния параметров конструкции на информационную способность резонаторных датчиков для измерения диэлектрической проницаемости [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко, А. А. Рябухин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 2001. – Вып. 120. – С. 162-165
172. Принципы разработки емкостных датчиков влажности газовых сред [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, А. В. Пашков, Н. И. Слипченко // Радиоэлектроника и информатика. – 2001. – № 2. – С. 38–41.
173. Решение прямых задач в теории СВЧ резонаторных измерительных преобразователей [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко, А. А. Рябухин // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ-2001) : зб. наук. пр. – Львів, 2001. – С. 116–119.
174. Улучшение метрологических характеристик СВЧ резонаторных измерителей влажности сыпучих материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. И. Кочержин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 2001. – Вып. 120. – С. 131–134.
175. Пат. 38308А Україна, МПК H01L21/66, G01N27/00. Спосіб вимірювання об'ємного часу життя та швидкості поверхневої рекомбінації носіїв заряду у напівпровідниках [Текст] / Гордієнко Ю. О., Бородин Б. Г. ; Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – № 2000063597 ; заявл. 21.06.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4. – 4 с. : ил.

2002

176. Ближнеполевая сканирующая сверхвысокочастотная микродиагностика объектов в технологии электроники [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Нові технології : наук. вісник ІЕНТ. – 2002. – № 1. – С. 3–6.
177. Емкостные датчики в информационном обеспечении электронных систем [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, А. В. Пашков, Н. И. Слипченко // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : по материалам 8-й Междунар. конф., 17–19 сент. 2002 г. – Х. : ХНУРЭ, 2002. – С. 359–360.
178. Исследование рекомбинационных процессов в полупроводниках спектральным методом [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, С. В.

- Бабыченко, А. И. Абу // Радиотехника и информатика. – 2002. – № 4. – С. 39–42.
179. Микроволновая диагностика полупроводниковых материалов и структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, А. И. Абу // Прикладная радиотехника. Состояние и перспективы развития : по материалам 1-го Междунар. радиотехнического форума, 8–10 окт. 2002 г. – Х., ХНУРЭ, 2002. – Ч. 2. – С. 323–325.
180. Микроволновая сканирующая микроскопия – перспективная область нанотехнологии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, А. А. Рябухин, Н. И. Слипченко // Прикладная радиотехника. Состояние и перспективы развития : по материалам 1-го Междунар. радиотехнического форума, 8–10 окт. 2002 г. – Х., ХНУРЭ, 2002. – Ч. 2. – С. 360–362.
181. Модуляционные преобразования информационных сигналов в резонансных измерителях параметров объектов и сред [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 2002. – Вып. 127. – С. 95–103.
182. Перспективные разработки для обеспечения высоких удельных характеристик солнечных батарей [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Прикладная радиотехника. Состояние и перспективы развития : по материалам 1-го Междунар. радиотехнического форума, 8–10 окт. 2002 г. – Х., ХНУРЭ, 2002. – Ч. 2. – С. 367–371.
183. Повышение точности обработки информации в резонансных измерителях параметров сред и объектов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Ю. Панченко // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : по материалам 8-й Междунар. конф., 17–19 сент. 2002 г. – Х. : ХНУРЭ, 2002. – С. 353–354.
184. Спектральные исследования рекомбинационных процессов в полупроводниках [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, С. В. Бабыченко, А. И. Абу // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : по материалам 8-й Междунар. конф., 17–19 сент. 2002 г. – Х. : ХНУРЭ, 2002. – С. 350–352.
185. Теоретические и экспериментальные основы СВЧ диагностики фундаментальных и прикладных свойств материалов и сред [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХНУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко; исполн. : Ю. И. Гуд, А. А. Рябухин. – № ГР 0100U001343. – Х., 2002. – 68 с.

186. Тонкопленочные СБИС: состояние и перспективы [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Д. Р. Яковлев // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития : по материалам 1-го Междунар. радиоэлектронного форума, 8–10 окт. 2002 г. – Х., ХНУРЭ, 2002. – Ч. 2. – С. 356–359.
187. Тонкопленочные фотовольтаические элементы на основе аморфных кремниевых сплавов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. С. Мазинов, Д. Р. Яковлев // Радиоэлектроника и информатика. – 2002. – № 2. – С. 22–27.
188. Электродинамическое моделирование СВЧ резонаторных сенсоров для гигрометрии газов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. В. Пашков, А. А. Рябухин, Н. И. Слипченко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х., 2002. – Вып. 129. – С. 115–118.
189. Пат. 50396А Україна, МПК G01R27/26, G01N22/04. Давач для вимірювання вологості діелектричних матеріалів [Текст] / Гордієнко Ю. О., Кочержин О. І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № 2002010026 ; заявл. 03.01.02 ; опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. – 2 с. : іл.
190. Пат. 52126А Україна, МПК G01N22/04. Спосіб вимірювання вологості діелектричних матеріалів [Текст] / Гордієнко Ю. О., Кочержин О. І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № 2002021575 ; заявл. 26.02.02 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. – 2 с. : іл.
191. Mathematical Aspects of the Field-Effect Method for Spectroscopy of Localized States in Disordered Semiconductors [Text] / Yu. E. Gordienko, D. R. Yakovlev // Telecommunications and radio engineering. – 2002. – Vol. 58, № 5. – P. 58–65.
192. Upgrading of Metrological Characteristics of MW-Resonator Moisture Meter for Free-Flowing Bulk Material [Text] / Yu. E. Gordienko, A. I. Kocherzhin // Telecommunications and radio engineering. – 2002. – Vol. 57, № 4. – P. 95–99.

2003

193. Информационные сигналы в СВЧ гигрометрии газов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. В. Пашков, Н. И. Слипченко // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : сб. тез. докл. по материалам Междунар. конф., 7–10 окт. 2003 г. – Х. ; Туапсе, 2003. – С. 145–146.
194. Модуляционные варианты СВЧ диагностики материалов и сред [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. И. Кочержин, А. В. Пашков, А. А. Рябухин

- // Радиотехника : науч.-техн. сб. – X. : ХНУРЭ, 2003. – Вып. 134. – С. 229–236.
195. Развитие прямого СВЧ диэлектрического метода гигрометрии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. В. Пашков, Н. И. Слипченко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – X. : ХНУРЭ, 2003. – Вып. 135. – С. 206–210.
196. Пат. 62343А Україна, МПК G01N22/04. Спосіб визначення вологості діелектричних матеріалів і пристрій для його здійснення [Текст] / Гордієнко Ю. О., Кочержин О. І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № 2003032056 ; заявл. 07.03.03 ; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. – 4 с. : іл.
197. Пат. 57427А Україна, H01L21/66, G01N27/00. Спосіб вимірювання об'ємного часу життя та швидкості поверхневої рекомбінації носіїв заряду у напівпровідниках [Текст] / Гордієнко Ю. О., Бородин Б. Г., Бабиченко С. В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № 2002107944 ; заявл. 07.10.02 ; опубл. 16.06.03, Бюл. № 6. – 4 с.
198. Modulation Conversions of Information Signals in Resonance Gauges of Parameters of Objects and Mediums [Text] / Yu. E. Gordienko, A. Yu. Panchenko // Telecommunications and radio engineering. – 2003. – Vol. 60, № 7. – P. 170–180.

2004

199. Матричный МДП-фотоёмкостной преобразователь тепловых изображений на основе немонокристаллического кремния [Текст] / Б. Г. Бородин, Ю. Е. Гордиенко, А. И. Абу // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : сб. тез. докл. по материалам 10-й Юбилейной междунар. конф., 28 сент. – 1 окт. 2004 г. – X. ; Туапсе, 2004. – Ч. 1. – С. 339–340.
200. Микроволновая микродиагностика материалов электронной техники [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, А. А. Рябухин, Н. И. Слипченко // Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології : зб. тез доповідей по матеріалам Міжнар. конф., 14–17 квітня 2004 г. – Кременчук, 2004. – С. 7–8.
201. Напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та технологія їх виробництва : підруч. [Текст] / Ю. О. Гордієнко, О. В. Бородин, С. С. Бурдукова, А. М. Гуржій. – X. : СМІТ, 2004. – 416 с.

202. Неразрушающий технологический СВЧ контроль параметров полупроводниковых структур на основе арсенида галлия [Текст] / С. В. Бабыченко, Б. Г. Бородин, Ю. Е. Гордиенко // Радиоэлектроника и информатика. – 2004. – № 2. – С. 43–47.
203. Оптимизация режимов питания неохлаждаемых полупроводниковых болометров [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. С. Мединский // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : сб. тез. докл. по материалам 10-й Юбилейной междунар. конф., 28 сент. – 1 окт. 2004 г. – Х. ; Туапсе, 2004. – Ч. 1. – С. 347–348.
204. Оценка направлений оптимизации СВЧ резонаторных датчиков контроля влагосодержания порошковых материалов электронной технологии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ф. М. Хаммуд // Радиоэлектроника и информатика. – 2004. – № 2. – С. 34–38.
205. Полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и технология их производства : учеб. пособие [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Н. Гуржий, А. В. Бородин, С. С. Бурдукова ; МОН Украины. – Х. : СМІТ, 2004. – 620 с.
206. СВЧ гигрометрия в технологических процессах [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. В. Пашков, Н. И. Слипченко // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : сб. тез. докл. по материалам 10-й Юбилейной междунар. конф. 28 сент. – 1 окт. 2004 г. – Х. ; Туапсе, 2004. – Ч. 1. – С. 366–367.
207. СВЧ технологии в контроле влагосодержания порошковых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ф. М. Хаммуд // Теория и техника передачи, приема и обработки информации : сб. тез. докл. по материалам 10-й Юбилейной междунар. конф., 28 сент. – 1 окт. 2004 г. – Х. ; Туапсе, 2004. – Ч. 1. – С. 343–344.
208. Численно-аналитическая модель эффективной СВЧ диэлектрической проницаемости структурно неоднородных объектов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. П. Герасимов, Ф. М. Хаммуд // Радиоэлектроника и информатика. – 2004. – № 4. – С. 26–31.
209. Пат. 61534А Україна, МПК H01L21/66. Тонкоплівковий перетворювач випромінювання прямої дії [Текст] / Бородин Б. Г., Гордієнко Ю. О., Яковлєв Д. Р. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № 2003021643 ; заявл. 25.02.03 ; опубл. 17.11.03, Бюл. № 11. – 4 с. : іл.

210. Пат. 71456А Україна, МПК G01N22/00. Інтегральний мікрополозковий резонаторний зонд мікрохвильового мікроскопа [Текст] / Рябухін О. О., Гордієнко Ю. О., Сліпченко М. І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № 20031213157 ; заявл. 30.12.03 ; опубл. 15.11.04, Бюл. № 11. – 2 с. : іл.
211. Particularities of Signals Formation in Microwave Microscopy [Text] / Yu. E. Gordienko, Y. Gud, N. Slipchenko // Modern problems of Radio Engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the International conference TSET 2004. – Lviv, Ukraine, 2004. – P. 289.
212. Optimization of the Measuring Information Signals in Microwave Hygrometry [Text] / Yu. E. Gordienko, A. Pashkov, N. Slipchenko // Modern problems of Radio Engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the International conference TSET 2004. – Lviv, Ukraine, 2004. – P. 256.

2005

213. Оценка численно аналитических моделей СВЧ резонаторных датчиков с коаксиальной измерительной апертурой [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Петров, Ф. М. Хаммуд // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2005. – Вып. 140. – С. 156–162.
214. СВЧ диэлектрическая проницаемость дисперсных влагосодержащих сред [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ф. М. Хаммуд, В. П. Герасимов // Радиопизика и радиоастрономия. – 2005. – Т. 10, № 3. – С. 334–340.
215. Формирование разупорядоченных структур и их преобразование в аморфную фазу в объеме (с-Si)-полупроводника осколками ядер, образующимися при γ -облучении расщепляющихся материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Н. Довбня, В. П. Ефимов и др. // Нові технології : наук. вісник ІЕНТ. – 2005. – № 1–2. – С. 11–16.

2006

216. Информационное направление повышения разрешающей способности микроволновой микроскопии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. И. Мельник, Н. И. Слипченко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2006. – Вып. 147. – С. 157–163.
217. Микрополосковые микроэлектронные системы [Текст] / В. В. Ананьин, Б. Г. Бородин, Ю. Е. Гордиенко // Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития : по

материалам первой Междунар. конф., 3 – 6 окт. 2006 г. – Х. ; Туапсе, 2006. – С. 517–518.

218. Особенности лавинного пробоя в кремниевых ПТШ по результатам численного моделирования [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. А. Зуев, В. В. Старостенко и др. // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2006. – Вып. 147. – С. 79–86.
219. Перспективы развития полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. Е. Кутний, А. В. Рыбка // Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития : по материалам Первой Междунар. конф., 3–6 окт. 2006 г. – Х. ; Туапсе, 2006. – С. 507–508.
220. СВЧ датчики для информационных систем мониторинга технического состояния объекта [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Петров, Е. В. Коробка // Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития : материалы Первой Междунар. конф., 3–6 окт. 2006 г. – Х. ; Туапсе, 2006. – С. 529–530.
221. СВЧ фотомодуляционный метод измерения параметров полупроводниковых пластин и спитаксиальных структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, А. В. Ващерук, С. Д. Сидоренко // Складні системи і процеси. – 2006. – №2. – С. 35–39.
222. Численная оценка потерь на излучение в СВЧ резонаторных датчиках с коаксиальной апертурой [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Петров // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2006. – Вып. 146. – С. 187–191.

2007

223. Алгоритм реконструкции изображений в ближнеполевой сканирующей микроволновой микроскопии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. И. Мельник, Н. И. Слипченко и др. // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2006. – Вып. 151. – С. 259–265.
224. Двухканальный преобразователь невидимых изображений прямого типа [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, А. С. Жерлицын // Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития : материалы второй междунар. конф., 2–5 окт. 2007 г. – Х. ; Туапсе, 2007. – С. 28–29.
225. Микроволновая диагностика и модификация материалов в нанотехнологиях [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко, С. И.

- Мельник и др. // Нанозифика и нанозлектроника : материалы 8-го Междунар. семинара, 7–8 дек. 2007 г. – К., 2007. – С. 53–54.
226. Микроволновая микроскопия полупроводниковых материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. И. Мельник, В. В. Петров, Н. И. Слипенченко // Матеріали III Української наукової конференції з фізики напівпровідників. – Одеса, 2007.
227. Микроволновый микроскоп с программной реконструкцией изображений [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. И. Мельник, Н. И. Слипенченко, В. В. Петров // Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития : материалы второй междунар. конф., 2–5 окт. 2007 г. – Х. ; Туапсе, 2007. – С. 42–43.
228. Общая теория СВЧ диагностики полупроводников и диэлектриков с помощью идеально одномодовых резонаторных измерительных преобразователей [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Е. Ю. Корягина, Н. И. Слипенченко // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2007) : материалы 17-й Междунар. Крымской микроволновой конф., 11–15 сент. 2007 г. – Севастополь, 2007. – С. 545–546.
229. Одномодовые резонаторные измерительные преобразователи в общей теории СВЧ диагностики материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Е. Ю. Корягина, Н. И. Слипенченко // Радиоэлектроника и информатика. – 2007. – № 2. – С. 4–8.
230. Полупроводниковые детекторы ионизирующих излучений с СВЧ смещением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. Е. Кутний и др. // Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития : материалы второй междунар. конф., 2–5 окт. 2007 г. – Х. ; Туапсе, 2007. – С. 30–31.
231. Разработка новых безэлектродных средств экспрессного контроля влажности сыпучих материалов для строительных и агропромышленных технологий [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХНУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : И. Н. Бондаренко, Ю. И. Гуд, В. В. Петров. – № ГР 0106U009108. – Х., 2007. – 258 с.
232. Реализация новых направлений повышения разрешающей способности микроволновой микроскопии полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. И. Мельник, В. В. Петров, Н. И. Слипенченко // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2007) : материалы 17-й Междунар. Крымской микроволновой конф., 11–15 сент. 2007 г. – Севастополь, 2007. – С. 547–548.

233. Формирование и анализ сигналов измерительной информации при СВЧ диагностике материала [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Е. Ю. Корягина, Н. И. Слипченко // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2007. – Вып. 151. – С. 239–245.
234. Чувствительность СВЧ резонаторных измерительных преобразователей для микроволновой микроскопии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко, В. В. Петров // Радиоэлектроника и информатика. – 2007. – № 3. – С. 19–23.

2008

235. Адаптация методики улучшения разрешающей способности к конкретным конструкциям микронзондов в микроволновой микроскопии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко В. В. Петров и др. // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития : материалы 1-й Междунар. конф., 30 сент. – 3 окт. 2008 г. – Х., 2008. – Т. III. – С. 98–100.
236. Діоди Шотткі типа $n\text{ZnSe}(\text{O},\text{Te})/\text{Ni}$ для детектування УФ випромінювання у біологічно активному діапазоні [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Г. Н. Бендеберя, Л. П. Гальчинецкий и др. // Сенсорная электроника и микросистемные технологии : материалы 3-й междунар. конф. – Одесса, 2008. – С. 241.
237. Компенсация влияния зазора между материалом и коаксиальным преобразователем на параметры измерителя влажности [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Д. А. Полетаев, А. А. Шадрин, Е. П. Таран // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития : материалы 1-й Междунар. конф. 30 сент. – 3 окт. 2008 г. – Х. ; Судак, 2008. – Т. III. – С. 80–83.
238. Микроволновая диагностика и модификация материалов в нанотехнологиях [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХНУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : В. В. Петров. Ю. И. Гуд, И. Н. Бондаренко, С. И. Мельник. – № ГР 0107U006676. – Х., 2008. – 264 с.
239. Оценка влияния зазора на величину выходных сигналов коаксиальных резонаторных измерительных преобразователей [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Д. А. Полетаев, В. В. Старостенко // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2008) : материалы 18-й Междунар. Крымской микроволновой конф. – Севастополь, 2008. – С. 548–549.

240. Перспективы развития микроволновой микроскопии для нанотехнологий [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко, С. И. Мельник, В. В. Петров // Сенсорная электроника и микросистемные технологии : материалы 3-й междунар. конф. – Одесса, 2008. – С. 156.
241. Повышение пространственной разрешающей способности микроволновой микроскопии полупроводников [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко, С. И. Мельник, А. Л. Ищенко // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2008) : материалы 18-й Междунар. Крымской микроволновой конф. – Севастополь, 2008. – С. 546–547.
242. Полупроводниковые детекторы ионизирующего излучения СВЧ смещением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2008) : материалы 18-й Междунар. Крымской микроволновой конф. – Севастополь, 2008. – С. 114–115.
243. Полупроводниковые радиационные детекторы с СВЧ смещением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, В. М. Ажажа и др. // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития : материалы 1-й Междунар. конф., 30 сент.–3 окт. 2008 г. – Х. ; Судак, 2008. – Т. III. – С. 45–46.
244. Разработка методов и технических средств СВЧ микродиагностики материалов, сред и структур [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / ХНУРЭ ; рук. Ю. Е. Гордиенко ; исполн. : Ю. И. Гуд, В. В. Петров, И. Н. Бондаренко. – № ГР 0106U003287. – Х., 2008. – 110 с.
245. Свойства четвертьволнового коаксиального СВЧ измерительного преобразователя для диагностики материалов [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Петров, Д. А. Полетаев // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2008. – Вып. 154. – С. 61–66.
246. СВЧ сенсоры различных физических величин [Текст] / Ю. Е. Гордиенко // Сенсорная электроника и микросистемные технологии : материалы 3-й междунар. конф. – Одесса, 2008. – С. 65.
247. Сигналы измерительной информации в СВЧ микро- и нанодиагностике полупроводниковых материалов и структур [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко, В. В. Петров // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2008) : материалы 18-й Междунар. Крымской микроволновой конф. – Севастополь, 2008. – С. 722–723.

248. Анализ собственных режимов резонансных систем радиационных полупроводниковых детекторов с СВЧ смещением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, А. С. Сорока, С. Ю. Ларкин // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития : материалы 2-й Междунар. науч. конф. 30 сент. – 3 окт. 2009 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2009. – С. 247–250.
249. Апаратно-програмний комплекс для визначення молекулярних механізмів розвитку патології організму людини та оптимізації процесу лікування кардіологічних захворювань різної етіології [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / ХНУРЕ ; кер. М. І. Сліпченко ; виконавці : І. М. Бондаренко, Ю. О. Гордієнко, А. І. Бих. – № ГР 0108U007614. – Х., 2009. – 156 с.
250. Ближнеполевой СВЧ датчик на основе конусного коаксиального резонатора [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. Ю. Ларкин, А. М. Яцкив // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2009. – Вып. 159. – С. 309–314.
251. Ближнеполевой СВЧ датчик на основе конусного коаксиального резонатора [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко, А. М. Яцкив // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2009) : материалы 19-й Междунар. Крымской конф., 14–18 сент. 2009 г. – Севастополь, 2009. – Т. 2. – С. 565–566.
252. Вклад колебательных и излучательных потерь в характеристики СВЧ преобразователей с коаксиальной измерительной апертурой [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Д. А. Полетаев // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2009. – Вып. 157. – С. 108–114.
253. Влияние излучательных потерь на характеристики СВЧ резонаторных преобразователей с коаксиальной апертурой [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, Д. А. Полетаев // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2009) : материалы 19-й Междунар. Крымской конф., 14–18 сент. 2009 г. – Севастополь, 2009. – Т. 2. – С. 561–562.
254. Вопросы разработки безэлектродных радиационных детекторов с СВЧ-смещением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г. Бородин, А. С. Сорока // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2009) : материалы 19-й Междунар. Крымской конф., 14–18 сент. 2009 г. – Севастополь, 2009. – Т. 2. – С. 793–794.

255. Применение резонаторного микрозонда для определения влагосодержания в биообъектах [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, Д. А. Полетаев // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития : материалы 2-й Междунар. науч. конф., 30 сент. – 3 окт. 2009 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2009. – С. 33–36.
256. Применение системы АПЧ измерительного генератора в микроволновой сканирующей микроскопии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Н. Бондаренко, С. Ю. Ларкин // Радіоелектроніка і інформатика. – 2009. – №4.
257. Системы формирования информационных сигналов в резонаторной микроволновой микроскопии [Текст] / И. Н. Бондаренко, Ю. Е. Гордиенко, С. Ю. Ларкин // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2009) : материалы 19-й Междунар. Крымской конф., 14–18 сент. 2009 г. – Севастополь, 2009. – Т. 2. – С. 563–564.
258. Формирование сигналов сканирования в микроволновой микроскопии с резонаторным микрозондом [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, И. Н. Бондаренко, С. Ю. Ларкин // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2009. – Вып. 158. – С. 59–67.
259. Шумовые характеристики полупроводниковых детекторов ионизирующего излучения с СВЧ-смещением [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, А. Б. Галат, Б. Г. Бородин // Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития : материалы 2-й Междунар. науч. конф., 30 сент. – 3 окт. 2009 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2009. – С. 78–80.
260. Электродинамические характеристики усовершенствованного резонаторного микрозонда для микроволновой микроскопии и микродиагностики [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Ю. И. Гуд, С. Ю. Ларкин, Д. А. Полетаев // Радиотехника : науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2009. – Вып. 159. – С. 302–308.

2010

261. Возможности проведения микроволновой сканирующей дефектometрии полупроводниковых материалов и структур / С. И. Мельник, Ю. Е. Гордиенко, Н. И. Слипченко // Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники : материалы 3-й Междунар. науч. конф., 28 сент. – 2 окт. 2010 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2010. – С. 99–102.

262. Высокочувствительный магнитный СКВИД-микроскоп на основе эффекта стохастического резонанса / О. Г. Турутанов, Ю. Е. Гордиенко, В. И. Шнырков // Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники : материалы 3-й Междунар. науч. конф., 28 сент. – 2 окт. 2010 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2010. – С. 95–98.
263. Коаксиальный резонаторный измерительный преобразователь для СВЧ влагометрии / Ю. Е. Гордиенко, В. В. Старостенко, А. А. Шадрин, Д. А. Полетаев // СВЧ техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2010) : материалы 20-й Междунар. Крымской конф., 13–19 сент. 2010 г. – Севастополь, 2010. – С. 1001–1002.
264. Методика микроволновой сканирующей томографии электрофизических свойств полупроводников / С. И. Мельник, Ю. Е. Гордиенко // СВЧ техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2010) : материалы 20-й Междунар. Крымской конф., 13–19 сент. 2010 г. – Севастополь, 2010. – С. 721–723.
265. Микроволновые ближнеполевые датчики нового поколения [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, Я. И. Лепих // СВЧ техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2010) : материалы 20-й Междунар. Крымской конф., 13–19 сент. 2010 г. – Севастополь, 2010. – С. 1041–1042.
266. Микроэлектронные датчики нового поколения для интеллектуальных систем / Ю. Е. Гордиенко // Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники : материалы 3-й Междунар. науч. конф., 28 сент. – 2 окт. 2010 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2010. – С. 5–12.
267. Основные аспекты общей теории сканирующей микроволновой микроскопии [Текст] / Ю. Е. Гордиенко, С. Ю. Ларкин // СВЧ техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2010) : материалы 20-й Междунар. Крымской конф., 13–19 сент. 2010 г. – Севастополь, 2010. – С. 1029–1030.
268. Объемный резонаторный измерительный преобразователь с коаксиальной апертурой для определения влагосодержания в малоразмерных объектах / Ю. Е. Гордиенко, А. А. Шадрин, Д. А. Полетаев и др. // СВЧ техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо`2010) : материалы 20-й Междунар. Крымской конф., 13–19 сент. 2010 г. – Севастополь, 2010. – С. 1014–1015.
269. Оптоэлектроника [Текст] : учеб. пособие / О. Б. Галат, Ю. О. Гордиенко, М. Г. Старшинський ; МОН Украины. – Х. : СМІТ, 2010. – 198 с.

270. Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем [Текст] : монографія / Я. І. Лепіх, Ю. О. Гордієнко, С. В. Дзядевич та ін. ; за ред. Я. І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с.
271. Near-field resonant sensors for scanning microwave microscopy / Yu. Gordienko, S. Larkin [Electronic resource] // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії : матеріали 10-ї Міжнар. конф. TCSET'2010, 23–27 лют. 2010 р. – Львів ; Славско : Львівська політехніка, 2010. – С. 104. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.
272. Biological objects parameters meter based on microwave microscope with coaxial resonant sensor [Electronic resource] / Yu. Gordienko, I. Bondarenko, N. Slipchenko // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії : матеріали 10-ї Міжнар. конф. TCSET'2010, 23–27 лют. 2010 р. – Львів ; Славско : Львівська політехніка, 2010. – С. 137. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

Наукова школа Ю. О. Гордієнка

Бедратий В. І. – канд. техн. наук
Бородін Б. Г. – канд. техн. наук
Гуд Ю. І. – канд. техн. наук
Костенко В. Л. – канд. техн. наук
Криворучко В. І. – канд. техн. наук
Оксаніч В. П. – д-р техн. наук
Панченко О. Ю. – д-р фіз.-мат. наук
Попов Ю. В. – канд. техн. наук
Свідерська Л. І. – канд. фіз.-мат. наук
Сліпченко М. І. – канд. техн. наук
Сліпченко М. І. – д-р фіз.-мат. наук
Солоухін М.Г. – канд. фіз.-мат. наук
Старостенко В. В. – канд. техн. наук
Старостенко В. В. – д-р фіз.-мат. наук
Росенко Є. О. – канд. техн. наук
Рябухін О. О. – канд. фіз.-мат. наук
Фар Р. С. – канд. фіз.-мат. наук
Хаммуд Ф. М. – канд. фіз.-мат. наук
Хорошайло Ю. Є. – канд. техн. наук
Чужиков І. Т. – канд. техн. наук

Іменний покажчик співавторів праць професора Ю. О. Гордієнка

Абу А. И.	178, 179, 184, 199
Ажажа В. М.	243
Александров Ю. М.	153
Алексеев В. А.	53, 92, 112
Ананьин В. В.	217
Антонова В. А.	136, 170
Арсентьев В. А.	85, 103, 104
Бабыченко С. В.	178, 184, 197, 202, 215
Бедратый В. И	55, 56, 60, 68
Бендеберя Г. Н.	236
Бых А.И.	249
Бондарь Б. Г.	136, 137, 144
Бондаренко И. Н.	231, 238, 244, 249, 256, 257, 258, 272
Боровская Т. И.	61
Бородин Б. Г.	45, 47, 51, 71, 72, 74, 75, 78, 84, 87, 89, 92, 95, 96, 100, 101, 105, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 141, 144, 147, 149, 151, 157, 160, 161, 170, 175, 178, 179, 184, 197, 199, 201, 202, 205, 209, 215, 217, 219, 221, 224, 230, 242, 243, 248, 254, 259
Борщев В. Н	86, 88, 121, 122, 123, 126
Буеров Г. В.	86
Булах В. И.	9, 12, 40, 153
Бурдукова С. С.	17, 24, 201, 205
Ванцан В. М.	153
Ващерук А. В.	221
Галат А. Б	259, 269
Гальчинецкий Л. П.	236
Герасимов В. П.	208, 214
Главчев И. Г.	85, 103
Горелик А. Л.	1
Гринев Б. В.	236
Гришковец В. И.	268
Гуд Ю. И.	16, 18, 21, 23, 28, 29, 37, 42, 44, 45, 48, 49, 53, 55, 57, 62, 69, 72, 76, 81, 82, 91, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 106, 111, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 135, 139, 140, 147, 148, 152, 156, 172, 177, 180, 185, 200, 211, 229, 231, 238, 244, 252, 253, 260

Гуржий А. М.	201, 205
Деркач В. П.	99
Дёмин В. С.	215
Дзядевич С. В.	270
Довбня А. Н	215
Долгий А. И.	85
Долженков В. А.	86
Дружинин А.О.	270
Дудкин Ю.А.	1, 4, 5, 8, 15, 17, 22, 28, 31, 45, 47, 51, 62, 63, 64, 71, 87, 88, 95, 102, 107, 110
Ефимов В. П.	215
Свтух А. А.	270
Жерлицын А. С.	224
Жуков Г. В.	62
Захарченко А. А	230
Зелинский В. Л.	115
Зуев С. А.	218
Ищенко А. Л.	223, 235, 241
Карнаушенко В. П.	95
Катрунов К. А.	236
Климовицкий А. М.	99
Клочко А. П.	42, 87, 107, 110, 121, 130
Коваленко Н. А	1
Коробка Е. В.	220
Корягина Е. Ю.	228, 229, 233
Костенко В. Л.	10, 13, 19, 20, 27, 32, 34, 39, 50
Кочержин А. И.	140, 162, 164, 174, 189, 190, 192, 194, 196
Криворучко В. И.	105, 108, 109, 113, 116, 117, 118, 119, 124
Крупа В. П.	30
Крячко О. В.	131
Кузьминский Ю.Р.	95
Куприян А. А.	92
Кутний В. Е.	219, 230, 243
Лавринович М. А.	153
Ларкин С. Ю.	248, 250, 256, 257, 258, 260, 267, 271
Лепих Я. И.	265, 270
Ленков С. В.	270
Лобанов А. В.	115
Лоза Ю. Х.	90
Лукомский В. Г.	126
Мазинов А. С.	187
Мединский В. С.	203

Медведев И. В.	99
Мельник А.И.	85
Мельник В. Г.	270
Мельник С. И.	216, 223, 225, 226, 227, 232, 235, 238, 240, 241, 261, 264
Мельникова Л. П.	27, 32, 48
Морщаков Е. А.	97
Никитский В. П.	62
Одарюк А. И.	85
Овчаренко Л. А.	42, 73, 76, 79, 80, 81, 91, 94, 95, 98, 102, 104, 106, 111, 120
Панченко А. Ю.	134, 145, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 173, 181, 183, 198
Пашков А. В.	172, 177, 188, 193, 194, 195, 206, 212
Пащенко О. Г.	4
Петров В. В.	213, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 245, 231, 232, 234, 235, 238, 240, 244, 245, 247
Письменецкий В. О.	136, 137
Полетаев Д. А.	237, 239, 245, 252, 253, 255, 260, 263, 268
Попов Ю. В.	49
Присенко М. О	136, 137
Пугачев Г. Д.	215
Романов В. О.	270
Росенко Е. А.	90, 99
Рыбка А. В.	219, 230, 243
Рябухин А. А.	150, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 173, 180, 185, 188, 194, 200, 210
Свечкин В. П.	107
Свидерская Л. И.	24, 36, 38, 41, 43, 70, 89, 105
Семенец Т. А.	215
Серяков А.Н.	122, 123, 126
Сидоренко С. Д.	221
Слипченко Н. И	99, 136, 137, 144, 170, 172, 177, 180, 188, 193, 195, 200, 206, 210, 211, 212, 216, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 247, 249, 251, 261, 272
Смуглий В. И.	141, 149, 151
Соболь Н. К.	6
Сорока А. С.	248, 254
Старжинский Н. Г.	236, 269
Старков В. Е.	72

Старостенко В. В.	15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 55, 56, 62, 80, 81, 218, 239, 255, 263
Степанов Р. М.	54, 58
Сухоруков И. В.	134, 139, 148, 152
Таран Е. П.	237
Тельбух А. М.	95
Терещенко В. Ю.	218
Туруганов О. Г.	262
Турчин Д. В.	268
Усанов Д. А.	225
Фар Р. С.	138, 143, 145, 146, 150
Федотов Д. А.	63, 71, 88
Фомина В. И.	54, 58
Фурдыло А. Ф.	161
Хазанович И. И.	54
Хаммуд Ф. М.	204, 207, 208, 213, 214
Хорошайло Е. С.	9, 11, 12, 14, 80, 88
Хорунжий В. А.	136, 137
Цырлин Л. Э.	40, 54
Черепков А. В.	121, 122, 123, 126
Черкашин Е. Ю.	61, 70, 80
Чужиков И. Т.	9, 11, 12, 14, 25, 40, 54, 58
Шадрин А. А.	218, 237, 263, 268
Шевченко В. Е.	22
Шнырков В. И.	262
Якивчук А. І.	136
Яковлев Д. Р.	166, 169, 186, 187, 191, 209
Яцкив А. М.	250, 251